

# 試験報告書

報告書番号:A-xxx-21-A

発行日:○年○月○日

この試験報告書は試験を実施した試料にのみ有効であり、試験を実施していない試料または、その試料を用いた製品や加工された製品のシールド効果を証明しているものではない。また、試験所の文書による承認無しに、この試験報告書を部分的に複写してはならない。

## 1. 申請者

会社名 :株式会社 KEC

所在地 :〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地2

## 2. テストサンプルの記述

No.	サンプル名	型式番号	製造番号	測定項目
1	パンチングメタル	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 電界 <input checked="" type="checkbox"/> 磁界 <input type="checkbox"/> 電磁界

## 3. シールド効果

500Hz - 100kHz (KEC法 : 電界 磁界)100kHz - 1000MHz (KEC法 : 電界 磁界)1GHz - 6GHz (GHz KEC法(改良同軸管法) : 電磁界)

## 4. 試験方法

KEC法:試験手順書番号 296-PKEC-01 R6 (2020/10/29)



一般社団法人KEC関西電子工業振興センター 試験事業部

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地2

Test Engineer(s)

Kentarō Jo

Approved by

Hironobu Matsuyama / Group Manager

目次

1. 改訂履歴.....	3
2. 試験所の情報.....	4
2.1. 試験施設.....	4
3. 試験システム.....	4
3.1. サンプルの一覧.....	4
3.2. サンプルの写真.....	4
3.3. 測定日.....	4
3.4. 特記事項.....	4
4. シールド効果.....	5
4.1. 試験結果.....	5
5. 試験時の配置写真.....	7
6. 測定機器の一覧.....	7

sample

## 1. 改訂履歴

Report Version	ページ	改訂内容	改訂理由	発行日	Status
A	-	初版による発行	-	○年○月○日	Original

sample

## 2. 試験所の情報

### 2.1. 試験施設

一般社団法人KEC関西電子工業振興センター 試験事業部  
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3丁目2番地2

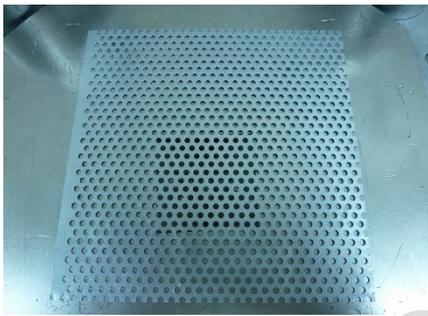
シールド材試験室

## 3. 試験システム

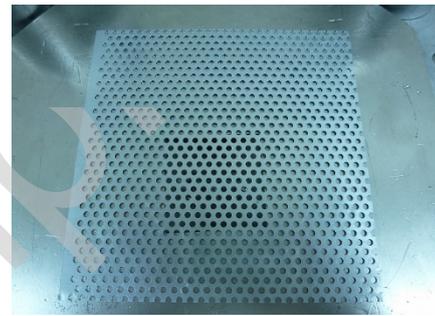
### 3.1. サンプルの一覧

No.	サンプル名	型式番号	製造番号	備考
1	パンチングメタル	-	-	000mm × 000mm × 0.0mm

### 3.2. サンプルの写真



No.1(表)



No.1(裏)

### 3.3. 測定日

供試装置の受取り日 : ○年○月○日  
試験品の状態 :  異常なし,  異常有り(詳細は報告書の中で記載)

測定完了日 : ○年○月○日  
試験品の状態 :  異常なし,  異常有り(詳細は報告書の中で記載)

### 3.4. 特記事項

なし,  あり(5. 試験時の配置写真参照)

#### 4. シールド効果

##### 4.1. 試験結果

Sample No.1

電界

Measured Frequency (MHz)	Shielding Effectiveness (dB)
0.100	24.41
0.200	32.84
0.300	34.47
0.400	35.91
0.600	37.50
0.800	37.39
1.000	37.80
2.000	38.36
3.000	38.48
4.000	38.95
5.000	38.91
6.000	38.97
7.000	38.94
8.000	39.00
9.000	39.04
10.000	39.08
15.000	39.08
20.000	39.14
30.000	39.06
40.000	39.06
50.000	39.17
60.000	39.12
70.000	39.19
80.000	39.22
90.000	39.25
100.000	39.20
130.000	39.30
150.000	39.25
170.000	39.28
200.000	39.25
250.000	39.34
300.000	39.35
350.000	39.45
400.000	39.68
450.000	39.66
500.000	40.04
550.000	40.05
600.000	40.33
650.000	40.92
700.000	40.78
750.000	41.72
800.000	42.25
850.000	42.50
900.000	44.10
950.000	44.14
1000.000	45.38

磁界

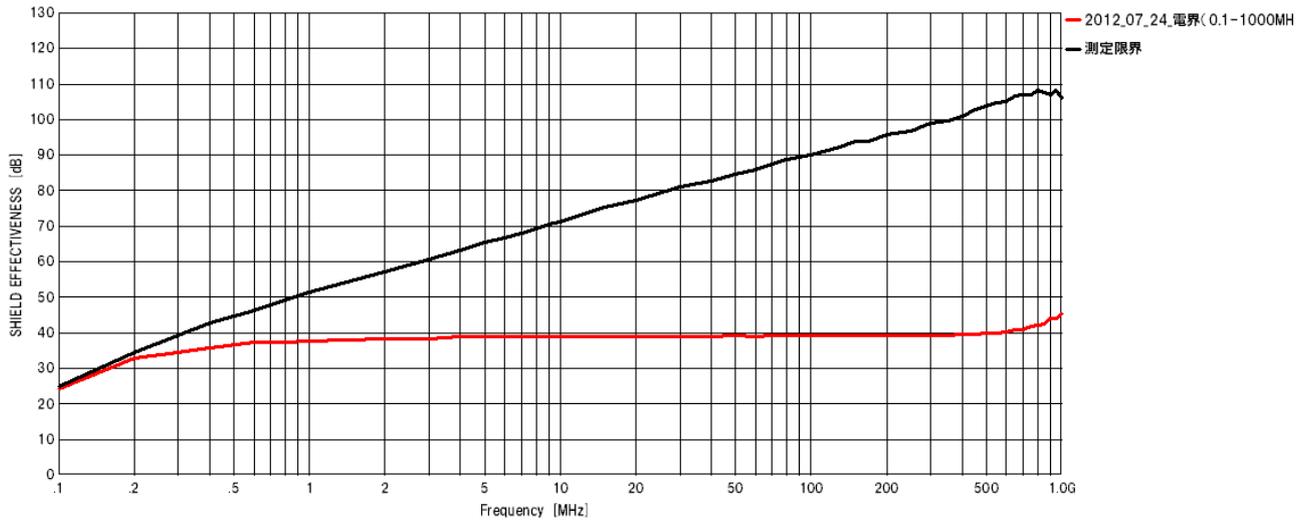
Measured Frequency (MHz)	Shielding Effectiveness (dB)
0.100	12.93
0.200	20.23
0.300	21.97
0.400	23.82
0.600	26.32
0.800	27.28
1.000	27.93
2.000	28.89
3.000	29.48
4.000	29.70
5.000	30.00
6.000	30.16
7.000	30.20
8.000	30.17
9.000	30.26
10.000	30.28
15.000	30.47
20.000	30.56
30.000	30.61
40.000	30.67
50.000	30.67
60.000	30.71
70.000	30.72
80.000	30.76
90.000	30.77
100.000	30.78
130.000	30.78
150.000	30.77
170.000	30.79
200.000	30.94
250.000	30.84
300.000	30.75
350.000	30.70
400.000	30.64
450.000	30.59
500.000	30.58
550.000	30.44
600.000	30.34
650.000	30.32
700.000	30.06
750.000	29.95
800.000	29.78
850.000	29.78
900.000	29.49
950.000	29.19
1000.000	29.20

**[注記]**

試験を実施した試料にのみ有効であり、試験を実施していない試料または、その試料を用いた製品や加工された製品のシールド効果を証明しているものではない。

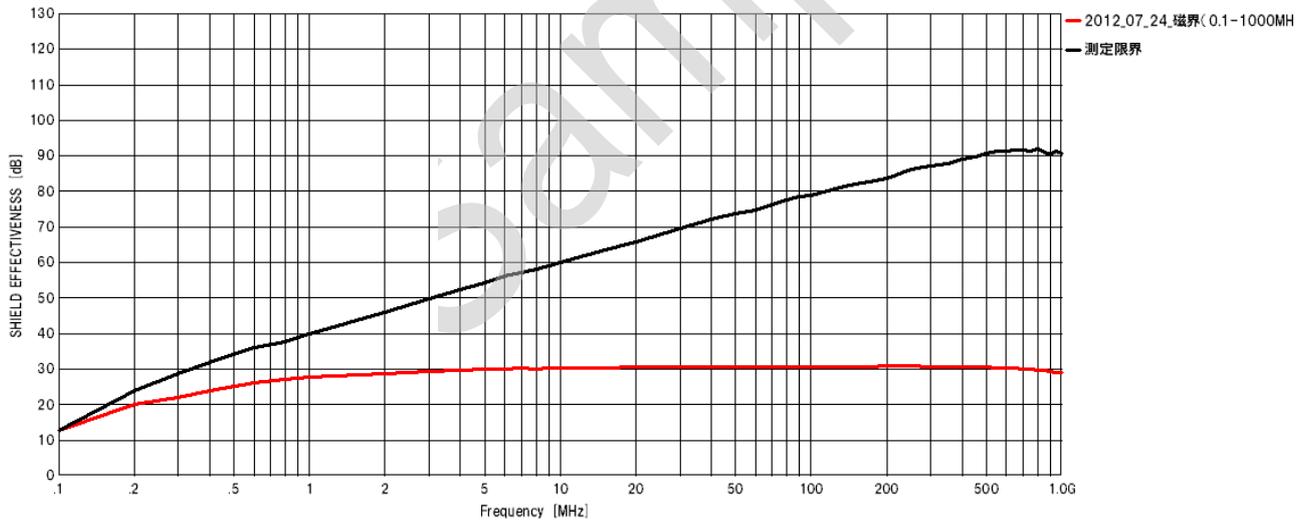
測定日	環境条件(試験前/試験後)		
	温度	湿度	気圧
〇年〇月〇日	〇〇 °C / 〇〇 °C	〇〇 % / 〇〇 %	〇〇〇〇 hPa

[電界]



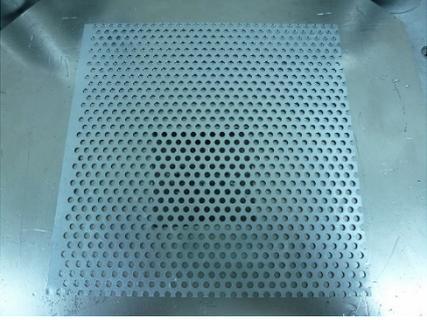
[記]  
周波数 0.2MHz 以下は電界の測定限界  
周波数 \_\_\_MHz 以上は電界の測定限界

[磁界]



[記]  
周波数 0.2MHz 以下は磁界の測定限界  
周波数 \_\_\_MHz 以上は磁界の測定限界

5. 試験時の配置写真

No.	配置写真	特記事項
1		<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 評価材料に方向性がある <input type="checkbox"/> 評価材料の表裏で結果が異なる <input type="checkbox"/> GHz 帯測定用に評価材料の面積を小さくした <input type="checkbox"/> 凹凸が多い <input type="checkbox"/> その他 (        )

6. 測定機器の一覧

・ シールド効果測定

管理番号	装置名称	製造業者社名	型式番号	校正日	次回校正日
AM-042	Pre-Amplifier	Anritsu	MH648A	2021/07	2022/07
AT-107	Fixed Attenuator	JFW	50HF-006N	2021/01	2022/01
AT-108	Fixed Attenuator	JFW	50HF-006N	2021/01	2022/01
MM-532	Shielding Effectiveness test fixtures of Rx Unit	KEC	-	Check (*1)	N/A
MM-533	Shielding Effectiveness test fixtures of Tx Unit	KEC	-	Check (*1)	N/A
MM-534	Shielding Effectiveness test fixtures of Rx Unit	KEC	-	Check (*1)	N/A
MM-535	Shielding Effectiveness test fixtures of Tx Unit	KEC	-	Check (*1)	N/A
MM-536	Fixed Jig	-	-	Check (*1)	N/A
SA-057	Spectrum Analyzer	Agilent	E4403B	2020/09	2021/10

注記:(\*1) この測定器は使用前に性能検査している。

測定機器の校正又は検証は、KEC における測定が国家標準又は海外の同等標準にトレーサブルであるよう、計画され運営されている。

以上